

05.2;07;11

©1995

**О ПРИРОДЕ ЦЕНТРОВ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
ТИОГАЛЛАТА КАДМИЯ**

B. T. Mak, A. M. Ebragim

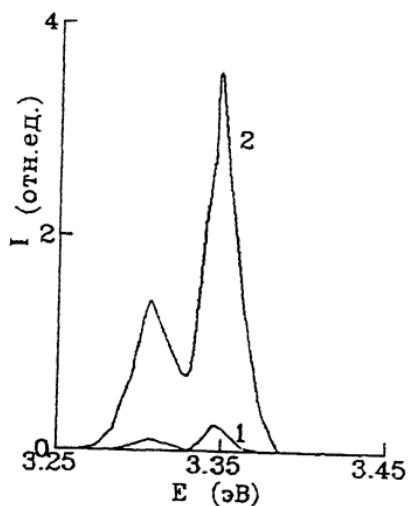
Фотолюминесценция кристаллов тиогаллата кадмия достаточно подробно исследовалась, например в [1–6]. В то же время поликристаллические пленки CdGa_2S_4 были синтезированы и исследованы лишь в работах [7,8]. Однако результаты исследований спектров фотолюминесценции (ФЛ) поликристаллического тиогаллата кадмия до настоящего времени не публиковались. Частично устранить указанный пробел призвана настоящая работа.

Исследуемые пленки были получены методом, описанным в [7]. Фотолюминесценция возбуждалась импульсным излучением азотного лазера с длиной волны 337 нм и регистрировалась при 77 К. Пленки подвергались изохронному отжигу по методике, описанной в [8].

Характерной особенностью спектров ФЛ пленок, отличающих их от спектров ФЛ монокристаллов, было наличие двух узких полос излучения в ультрафиолетовой области спектра при 3.348 эВ (I_1) и 3.307 эВ (I_2) (см. рисунок), о которых мы не встречали информации в опубликованной литературе. Интенсивность излучения исходных пленок в этой области была примерно в 10–20 раз меньшей, чем в отожженных при 760 К 15 мин.

Энергетическое положение максимумов ультрафиолетовой ФЛ вблизи края фундаментального поглощения свидетельствует о том, что соответствующий центр свечения расположен вблизи разрешенной зоны, а большая интенсивность коротковолнового максимума по сравнению с интенсивностью длинноволнового делает обоснованным предположение о том, что за анализируемое излучение ответственны донорно-акцепторные (ДА) пары с различным расстоянием между донором и акцептором.

Из известных литературных данных наиболее близко к зоне проводимости расположена донорный уровень вакансии серы (V_S) [1]. Его энергия ионизации $E_d = 0.3$ эВ. Энергия активации темновой проводимости исходных пленок в



Спектральное распределение фотолюминесценции неотожженных (кривая 1) и отожженных при 760 К (кривая 2) пленок CdGa₂S₄.

области низких температур и отожженных пленок в области температур 77–300 К была 0.3 эВ, причем после отжига концентрация дефектов, ответственных за эту проводимость, возрастила [8]. Отжиг пленок тиогаллата кадмия сопровождается испарением из них кадмия [7,8], что приводит к возрастанию концентрации междуузельных атомов галлия [Ga_i] и серы [S_i]. Поэтому можно предположить, что донором в анализируемых ДА парах является Ga_i, а не V_S. С другой стороны, наиболее вероятным акцептором в ДА парах, ответственных за ультрафиолетовую ФЛ, являются S_i, поскольку остальные возможные акцепторные дефекты в CdGa₂S₄ (Cd_{Ga}, V_{Cd} и др.) расположены на значительном удалении (более 1 эВ) от валентной зоны [1,7].

Учитывая, что расстояние между компонентами ДА пары порядка постоянной решетки (для исследуемых пленок CdGa₂S₄ $a = b = 0.55413$ нм, $c = 1.0126$ нм), а короткодействующей частью потенциала, учитывающей взаимодействие электрона с акцептором, дырки с донором и электрона с дыркой, при таких расстояниях можно пренебречь [9], энергию, излучаемую при ДА рекомбинации, можно вычислить в соответствии с соотношением

$$h\nu = E_g - E_d - E_a + \frac{e^2}{\varepsilon r},$$

в котором использованы общепринятые обозначения.

Записав это соотношение для полос I_1 и I_2 при $r_1 = na$ и $r_2 = (n + i)a$ соответственно, где n — целое число, после

ненсложных вычислений получим* $n = 3$. Следовательно, полосы излучения I_1 и I_2 обусловлены ДА рекомбинации пар, расстояние между донором и акцептором в которых $r_1 = 3a$ и $r_2 = 4a$ соответственно. Эти же вычисления дают положение энергетического уровня изолированного акцептора $E_{a1} = E_{a2} = 0.25$ эВ.

Таким образом, впервые наблюдавшаяся ультрафиолетовая фотolumинесценция с максимумами излучения при 3.348 эВ (I_1) и 3.307 эВ (I_2) обусловлена ДА рекомбинации. Компонентами ДА пар являются доноры Ga_i и акцепторы S_i , разделенные пространственно на расстояние $3a$ и $4a$. Энергетическое положение донора $E_d = E_c - 0.3$ эВ и акцептора $E_a = E_v + 0.25$ эВ.

Список литературы

- [1] Георгобиани А.Н., Илюхина З.П., Радауцан С.И., Тигиняну И.М. Исследование фотоэлектрических и люминесцентных свойств монокристаллов $CdGa_2S_4$, $ZnIn_2S_4$ и системы $ZnS:In$, полученной ионным внедрением. Москва, 1981. Препринт № 259. С. 47.
- [2] Георгобиани А.Н., Дону В.С., Илюхина З.П., Павленко В.И., Тигиняну И.М. // Краткие сообщения по физике. 1981. № 12. С. 48.
- [3] Георгобиани А.Н., Дерид Ю.С., Радауцан С.И., Тигиняну И.М. // Краткие сообщения по физике. 1983. № 8. С. 46.
- [4] Георгобиани А.Н., Дону В.С., Илюхина З.П., Павленко В.И., Тигиняну И.М. // ФТП. 1983. № 17. С. 1524.
- [5] Георгобиани А.Н., Радауцан С.И., Тигиняну И.М. // ФТП. 1985. № 19. С. 193.
- [6] Георгобиани А.Н., Грузинцев А.Н., Илюхина З.П., Мызина В.А., Радауцан С.И., Тигиняну И.М. // Изв. АН СССР. Неорган. матер. 1985. Т. 21. С. 1457.
- [7] Мак В.Т., Ибрагим А.А. // ФТП. 1994. № 28. С. 1714.
- [8] Мак В.Т., Ибрагим А.А. // Изв. РАН. Неорган. матер. 1995. № 31. С. 1.
- [9] Williams F.E. // J. Phys. and Chem. Solids. 1960. N 12. P. 265.
- [10] Тазлеван В.Е. Сложные полупроводники. Кишинев, 1988. С. 163.

Одесский государственный
университет

Поступило в Редакцию
16 июня 1995 г.

* Использовано значение $\epsilon = 5.78$ и $E_g = 3.787$ эВ при 77 К [10].